

### PRACOWNIA FIZYCZNA 1

Instytut Fizyki Centrum Naukowo Dydaktyczne



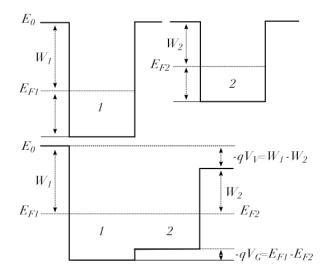
# P1-F5. Badanie zjawiska Peltiera

# Zagadnienia

Struktura pasmowa półprzewodnika. Praca wyjścia. Poziom Fermiego. Kontaktowa różnica potencjałów, wewnętrzna i zewnętrzna. Zjawisko Seebecka. Zjawisko Peltiera.

## 1 Wprowadzenie

Na rys. 1 przedstawiono schematycznie sytuację energetyczną elektronów w dwóch metalach, o różnych położeniach energii (poziomu) Fermiego ( $E_{F1} \neq E_{F2}$ ) i pracach wyjścia ( $W_1 \neq W_2$ ). Gdy te ośrodki zostaną zbliżone do siebie na taką odległość, by mogła nastąpić wymiana nośników między nimi, układ będzie dążyć do stanu równowagi, w którym wyrównują się poziomy Fermiego mierzone względem poziomu próżni  $E_0$ . Jeżeli sytuacja jest taka, jak na rys. 1, w metalu 2 część elektronów posiada energie wyższe niż



Rys. 1: Dwa metale o różnych pracach wyjścia  $W_1$  i  $W_2$  i różnych poziomach Fermiego  $E_1$  i  $E_2$ 

poziom Fermiego w metalu 1, więc następuje dyfuzja elektronów z metalu 2 do metalu 1. Metal 1 ładuje się ujemnie, a metal 2 - dodatnio, i na złączu wytwarza się równowagowa kontaktowa różnica potencjałów, zwana zewnętrznym napięciem kontaktowym lub napięciem Volty, proporcjonalnym do różnicy prac wyjścia [1]

$$V_V = -\frac{1}{a} (W_1 - W_2), \qquad (1)$$

gdzie q jest wartością bezwzględną ładunku elektronu. Z kolei różnica potencjałów wynikająca z różnicy poziomów Fermiego (która jest wyznaczana względem dna studni potencjału) nazywa się wewnętrznym napięciem kontaktowym lub napięciem Galvaniego

$$V_G = -\frac{1}{q} \left( E_{F1} - E_{F2} \right). \tag{2}$$

Przyczyną występowania zjawisk termoelektrycznych na złączu dwóch materiałów przewodzących, o różnych pracach wyjścia i położeniach poziomów Fermiego, jest zależność energii Fermiego od temperatury

$$E_F(T) = E_F^0 \left[ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{kT}{E_F^0} \right)^2 \right]. \tag{3}$$

#### 1.1 Zjawisko Seebecka

Napięcie Galvaniego jest funkcją temperatury na mocy zależności (3)

$$V_G = -\frac{1}{q} (E_{F1}^0 - E_{F2}^0) + \frac{\pi^2 k^2 T^2}{12q} \left( \frac{1}{E_{F1}^0} - \frac{1}{E_{F2}^0} \right). \tag{4}$$

Umieszczenie spojenia w temperaturze  $T_A \neq T_B$  powoduje podniesienie temperatury spojenia o  $\Delta T =$  $T_B - T_A$  i wzrost wewnętrznej kontaktowej różnicy potencjałów o

$$\Delta U = V_{GB} - V_{GA} = \frac{\pi^2 k^2}{12q} \left( \frac{1}{E_{F1}^0} - \frac{1}{E_{F2}^0} \right) (T_B^2 - T_A^2). \tag{5}$$

Jeżeli przyjmie się  $T_A=T,$ wówczas  $T_B=\Delta T+T$ 

$$T_B^2 - T_A^2 = (T_B - T_A)(T_B + T_A) = \Delta T(T_B + T_A) =$$

$$= \Delta T(\Delta T + 2T) = \Delta T^2 + 2T\Delta T \cong 2T\Delta T$$
(6)

$$= \Delta T(\Delta T + 2T) = \Delta T^2 + 2T\Delta T \cong 2T\Delta T \tag{7}$$

co jest prawdą gdy  $\Delta T^2$  jest wielkością niewielką w porównaniu z T. Zatem kontaktowa różnica potencjałów na złączu utrzymywanym w temperaturze  $T + \Delta T$  jest proporcjonalne do  $\Delta T$ 

$$\Delta U = \frac{\pi^2 k^2 T}{6q} \left( \frac{1}{E_{F1}^0} - \frac{1}{E_{F2}^0} \right) \Delta T. \tag{8}$$

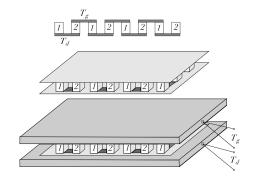
Utworzenie obwodu elektrycznego, złożonego z dwóch (pół)przewodników (i dwóch ścisłych spojeń tych (pół) przewodników) i umieszczenie jednego ze spojeń w innej temperaturze  $T_A \neq T_B$  spowoduje powstanie w obwodzie różnicy potencjałów (siły elektromotorycznej)

$$U_{AB} = V_A - V_B = \frac{\pi^2 k^2}{12q} \left( \frac{1}{E_{F1}^0} - \frac{1}{E_{F2}^0} \right) (T_A^2 - T_B^2). \tag{9}$$

Efekt ten nazywa się zjawiskiem Seebecka [2].

#### 1.2 Zjawisko Peltiera

Podczas przepływu prądu elektrycznego przez spojenie dwóch różnych półprzewodników (lub przewodników) obserwuje się emisję ciepła (ogrzewanie złącza) lub pobieranie ciepła z sieci krystalicznej (ochładzanie złącza). Wymiana ciepła z otoczeniem, oparta o zjawisko termoelektryczne, została zaobserwowana w 1834 roku przez francuskiego fizyka Jean Charles Athanase Peltier'a i jest wykorzystywana w elementach elektronicznych, zwanych elementami Peltiera, służących do budowy układów chłodzących i stabilizujących temperaturę w różnych zastosowaniach technicznych.



Rys. 2: Konstrukcja elementu Peltiera

Ilość ciepła pobieranego lub wydzielanego na złączu w czasie t, podczas przepływu przez niego prądu o natężeniu i, jest proporcjonalna do ładunku q, który przepływa przez złącze

$$Q = \Pi q = \int_{0}^{t} \Pi i \mathrm{d}t,$$

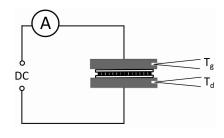
gdzie Π jest złożoną stałą materiałową zależną od właściwości elektronowych materiałów tworzących złącze. Ciepło Peltiera zależy liniowo od natężenia prądu i może być wydzielane lub pochłaniane w zależności od kierunku przepływającego prądu. W przypadku materiałów o jednakowym przewodnictwie (elektronowym, lub dziurowym), zjawisko Peltiera jest spowodowane różnicą energii nośników w tych materiałach, liczoną względem dna studni potencjału (1). Jeśli nośnik pod wpływem przyłożonego napięcia porusza się przez złącze w stronę obszaru, w którym jego energia względem dna studni potencjału będzie mniejsza, wówczas nadmiar energii przekaże do sieci krystalicznej i takie złącze się ogrzeje [3].

Konstrukcję elementu Peltiera przedstawia rys. 2. Element składa się z półprzewodnika typu n (1) i półprzewodnika typu p (2), połączonych elementami miedzianymi szeregowo w taki sposób, że złącza 1-2 znajdują się z jednej strony, a złącza 2-1 z drugiej strony elementu. Całość jest przykryta z obu stron płytkami ceramicznymi. Przy wymuszeniu przepływu prądu przez taki układ, jedna strona elementu zyskuje temperaturę  $T_q$ , a druga temperaturę  $T_d$ .

Czułość danego modułu Peltiera  $(\Lambda)$  jest definiowana jako współczynnik proporcjonalności między różnicą temperatur powierzchni elementu a prądem przez niego przepływającym

$$\Delta T = T_g - T_d = \Lambda i.$$

## 2 Układ pomiarowy



Rys. 3: Schemat układu pomiarowego

W układzie pomiarowym element Peltiera umieszczony jest między dwiema grubymi płytkami aluminiowymi. W płytkach nawiercono otwory, w których umieszczono czujniki temperatury  $T_d$  i  $T_g$ . Element jest szeregowo połączony z zasilaczem prądu stałego i amperomierzem. Po włączeniu prądu w obwodzie, efekt Peltiera zachodzi natychmiast, jednak zanim w układzie ustali się stan równowagi termicznej, konieczne jest odczekanie odpowiedniego czasu (około 7-10 minut). Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika czułości elementu Peltiera czyli wielkości która charakteryzuje osiąganą przez element różnicę temperatur  $\Delta T$ , przypadającą na 1 A przepływającego prądu.

# 3 Pomiary

- 1. Połączyć układ według schematu przedstawionego na rys. 3.
- 2. Ustawić natężenie prądu 0.5 A i odczekać odpowiednią ilość czasu do stabilizacji temperatury w płytkach aluminiowych.
- 3. Zanotować temperatury w płytkach aluminiowych.
- 4. Powtórzyć czynności z krokiem 0.5 A aż do 3 A.
- 5. Odwrócić polaryzację źródła prądowego.
- 6. Dla natężeń prądu od 0 do 3 A co 0.5 A notować temperatury w płytkach aluminiowych.

Tab. 1: Wzór tabeli pomiarowej

Lp.	I, A	u(I), A	$T_d, ^{\circ}C$	$T_g,^{\circ}C$	$\Delta T$ , K	$u(\Delta T)$ , K
1.						
2.						

# 4 Opracowanie wyników pomiarów

- 1. Dla każdego natężenia prądu obliczyć różnicę temperatur  $\Delta T$  wygenerowaną przez element Peltiera i wyrazić ją w kelwinach.
- 2. Na podstawie informacji o niepewności pomiaru temperatur  $T_g$  i  $T_d$ , korzystając z prawa przenoszenia niepewności, obliczyć niepewność wyznaczenia  $\Delta T$ .
- 3. Wyznaczyć niepewności wszystkich pomiarów natężenia prądu I.
- 4. Sporządzić wykres  $\Delta T = f(I)$ .
- 5. Na wykresie zaznaczyć słupki niepewności naniesionych punktów pomiarowych.
- 6. Metodą regresji liniowej wyznaczyć współczynniki otrzymanej prostej i zapisać je w poprawnym formacie wraz z jednostkami.
- 7. Czułość modułu Peltiera to współczynnik nachylenia prostej. Jaka jest różnica temperatur na module Peltiera, przypadająca na 1 A płynącego przez niego prądu?

### Literatura

- [1] S Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Część III Elektryczność i magnetyzm. PWN, 1980.
- [2] Z Kleszczewski. Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego. Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2000.
- [3] J Bodzenta. Wykłady z fizyki. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009.